

SUPPORT PHOTO POUR LA CHAMBRE DE DIFFRACTION DE RAYONS X GUINIER-SIMON , HAUTE TEMPÉRATURE ENRAF-NONIUS

FICHE N° 4020

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : ENRAF-NONIUS

Domaines : Chimie, Physique

Sous-domaines : Cristallographie, Chimie du solide, Cristallographie, Physique du solide

Organisme : Université de Rennes

Ville : Rennes

Modèle : FR 553

Matériaux : Métal

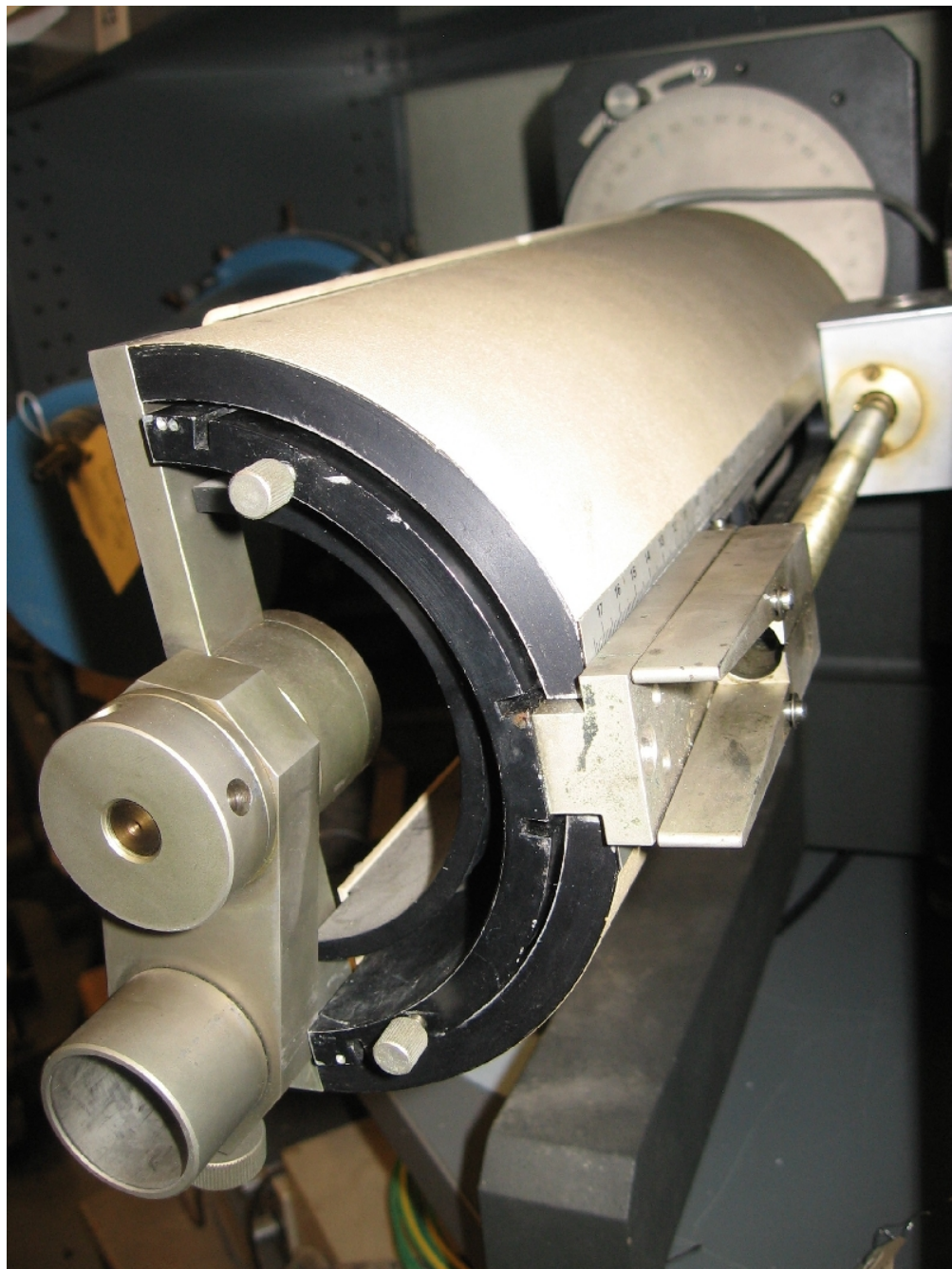
Description

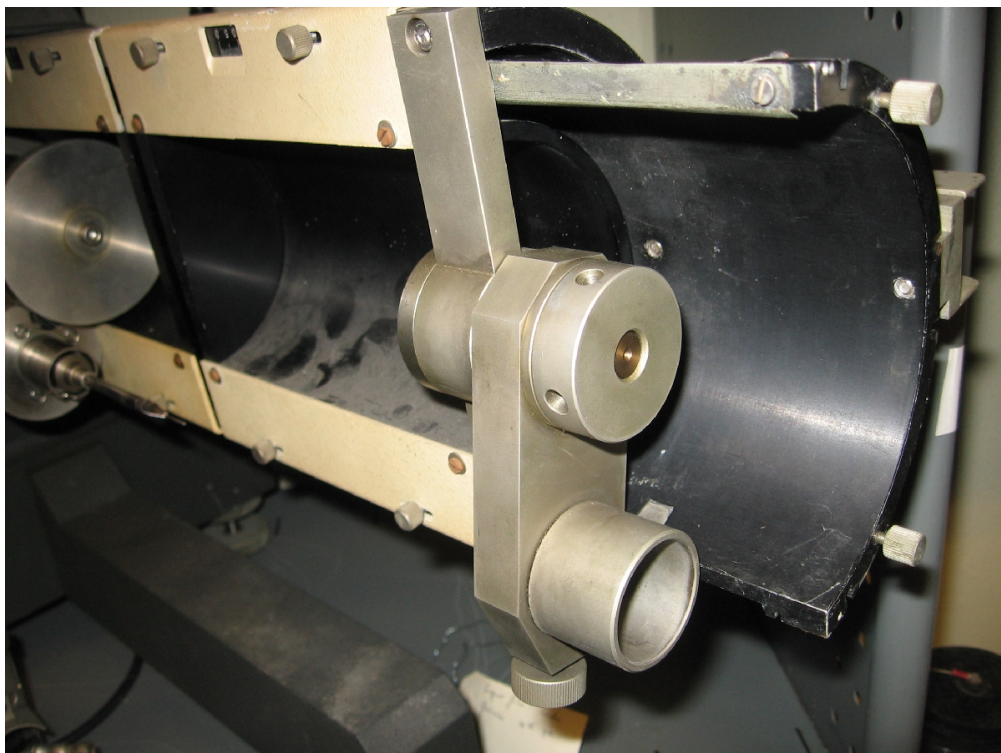
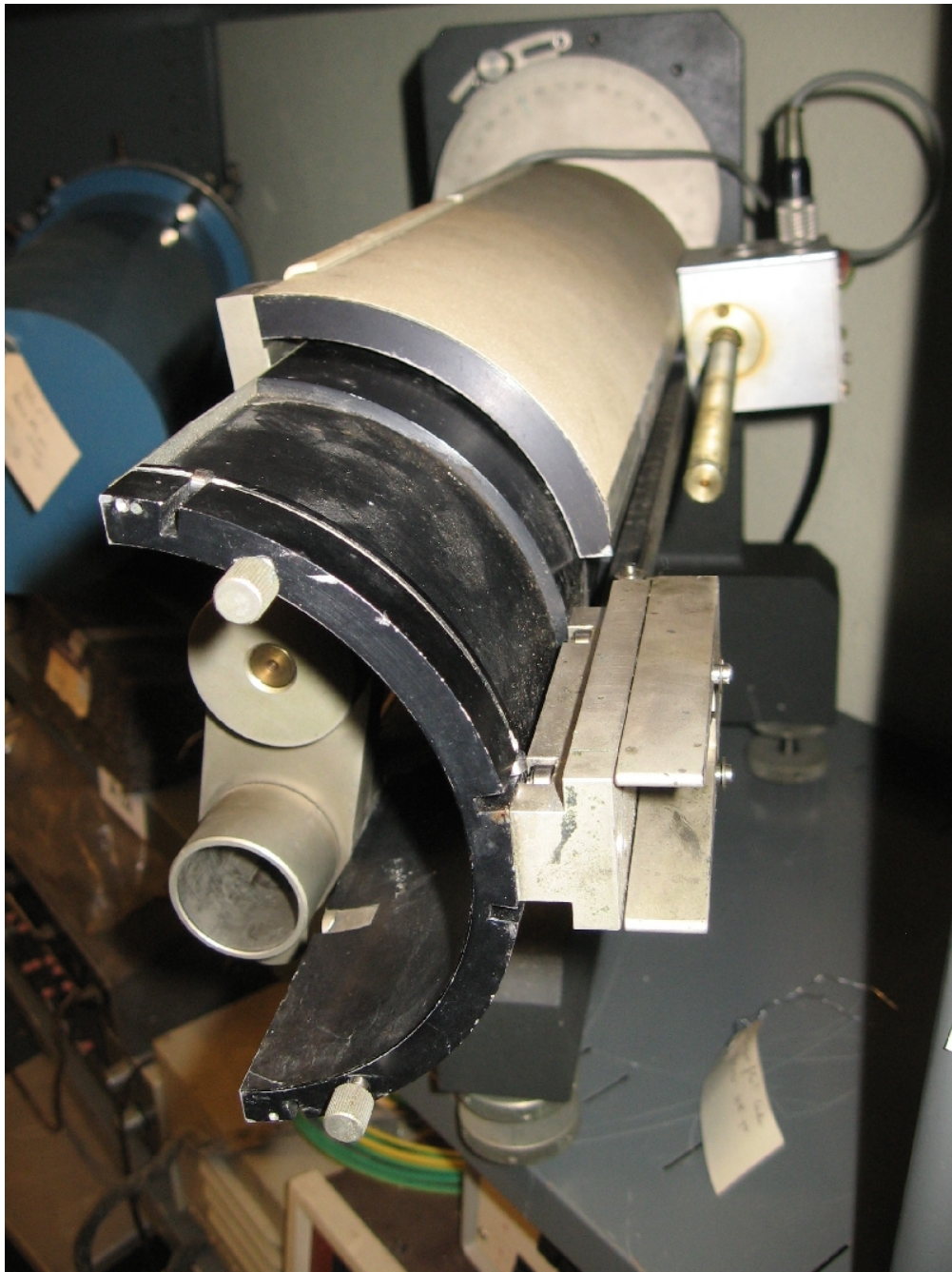
Ce support photo équipait la chambre de diffraction des rayons X Guinier-Simon commercialisée par la société Enraf-Nonius dans les années 1980. Il se présente sous la forme d'une petite plaque métallique noire de forme circulaire munie d'un système de fixation dans sa partie externe et est équipé de vis moletées. Le film photographique est positionné à l'intérieur du cylindre. L'ensemble est introduit dans la chambre de rayons X dans un support cylindrique conçu à cet effet.

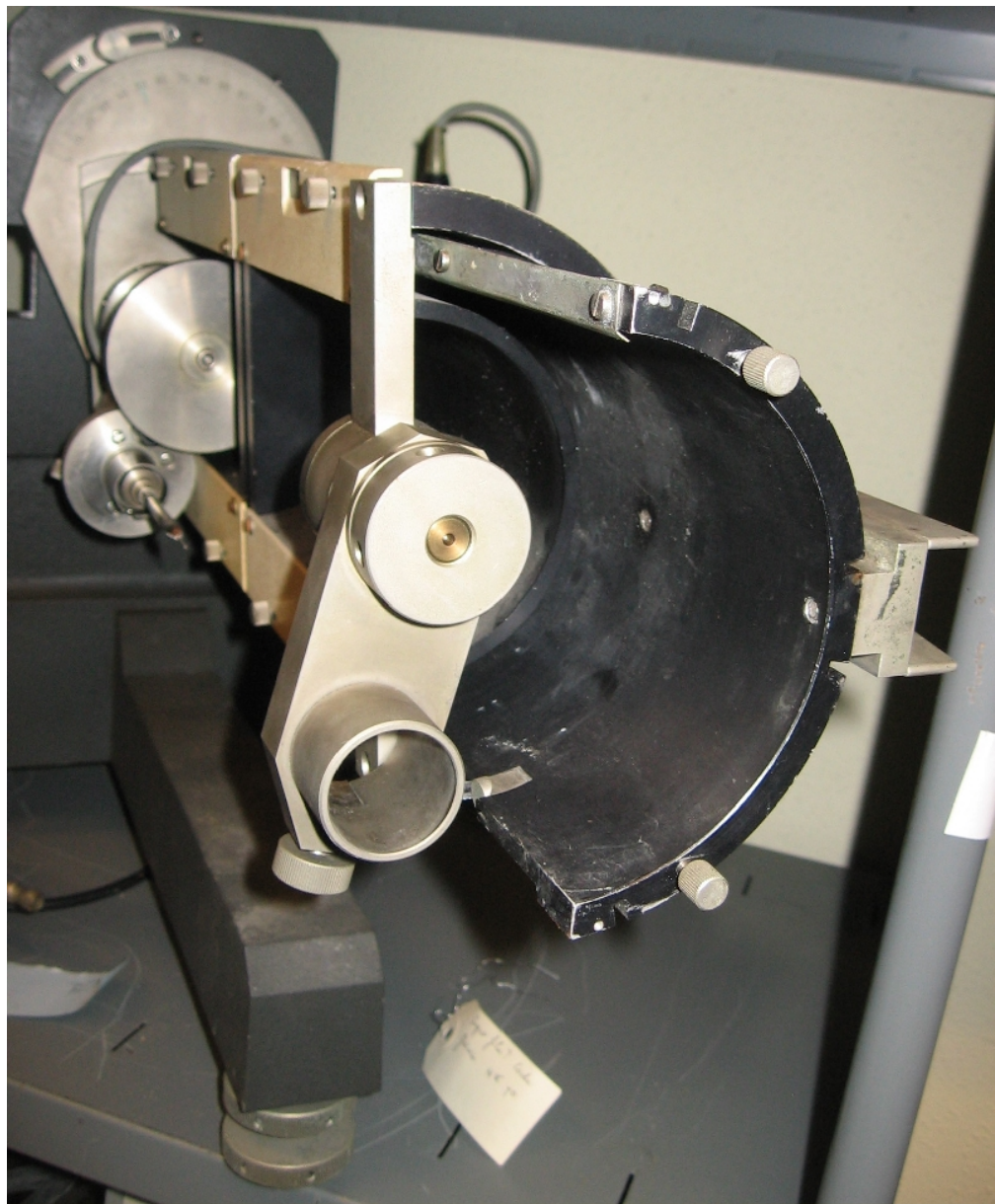
Utilisation

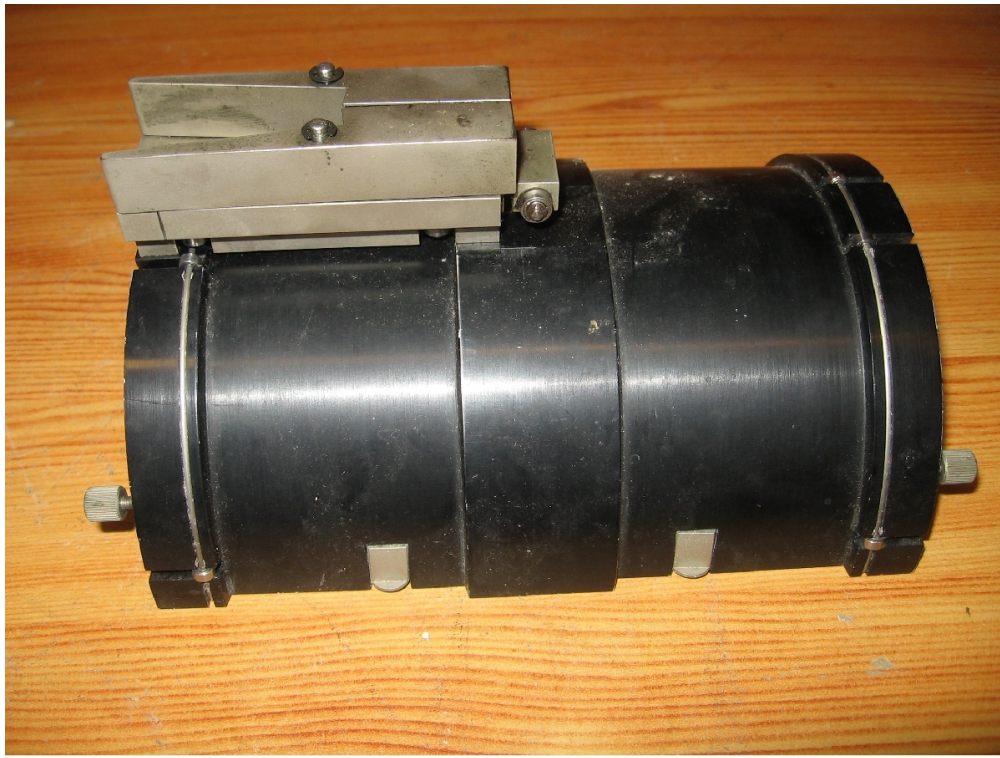
La chambre de Guinier-Simon de diffraction des rayons X servait à effectuer des études cristallographiques d'échantillon cristallin. Des recherches du comportement des matériaux dans ces gammes de température se révélaient très utiles notamment pour la détection de changements de phase.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Support photo pour la chambre de diffraction de rayons X Guinier-Simon , Haute Température Enraf-Nonius (ENRAF-NONIUS), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=16038>, consulté le 2026-07-28